附件：

会议审定、预审和讨论的标准项目

| 序号 | 计划编号 | 项目名称 | 起草单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国标委发[2018]60号20181807-T-469 | [硅外延层载流子浓度的测试 电容-电压法](http://zxd.sacinfo.org.cn:7001/default/com.sac.tpms.core.common.detailForQuery.projectDetailInfo.flow?projectID=113384&stage=plan) | 南京国盛电子有限公司 | 审定 |
|  | 国标委发[2018]60号20181809-T-469 | 硅单晶电阻率的测定 直排四探针法和直流两探针法 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 预审 |
|  | 国标委发[2019]11号20190796-T-469 | [硅片表面薄膜厚度的测试 光学反射法](http://zxd.sacinfo.org.cn:7001/default/com.sac.tpms.core.common.detailForQuery.projectDetailInfo.flow?projectID=122381&stage=plan" \t "_blank) | 有研半导体材料有限公司 | 预审 |
|  | 工信厅科函[2019]126号[2019-0398T-YS](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPXT05392019) | 氯硅烷中碳含量的测定 气相色谱质谱联用法 | 亚洲硅业（青海）股份有限公司 | 预审 |
|  | 中色协科字[2019]17号2019-006-T/CNIA | 电子工业用高纯氢氟酸中痕量阴离子含量的测定 离子色谱法 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司 | 预审 |
|  | 中色协科字[2019]17号2019-007-T/CNIA | 电子工业用高纯氢氟酸中痕量杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司 | 预审 |
|  | 中色协科字[2019]17号2019-008-T/CNIA | 电子工业用高纯硝酸中痕量阴离子含量的测定 离子色谱法 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司 | 预审 |
|  | 中色协科字[2019]17号2019-009-T/CNIA | 电子工业用高纯硝酸中痕量杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司 | 预审 |
|  | 中色协科字[2019]144号  2019-0031-T/CNIA | 电子工业用高纯硫酸 | 苏州汉谱埃文材料科技有限公司 | 预审 |
|  | 工信厅科[2018]73号2018-2056T-YS | 硅碳复合负极材料化学分析方法 第1部分：硅含量的测定 重量法和分光光度法 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 预审 |
|  | 工信厅科[2018]73号2018-2057T-YS | 硅碳复合负极材料化学分析方法 第2部分：碳含量的测定 高频加热红外吸收法 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 预审 |
|  | 工信厅科[2018]73号2018-2058T-YS | 硅碳复合负极材料化学分析方法 第3部分：铁、镍、锆、钙、铅、铝、铪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 预审 |
|  | 国标委发[2019]40号20194173-T-469 | 硅片翘曲度和弯曲度的测试 自动非接触扫描法 | 有研半导体材料有限公司 | 讨论 |
|  | 中色协科字[2020]8号  2020-023-T/CNIA | 多晶硅生产用氢气中金属杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司 | 讨论 |